

DP WGの活動報告(第39回研究会)

参加者 : 荒木(日産アーク)、山内(矢崎総業)、有明(秋田産技C)、荒井(住金)
一條(マクセル)、梯(三菱マテリアル)、奥村(三菱マテリアル)、酒井(トクヤマ)
荻原(NIMS)、堤(JEOL)、永富(阪大)、高橋(島津)佐藤(富士通クオリティラボ)
斉藤(サーモ)、佐藤(帝人)、石津(パナソニック)

今回の議論内容

- 共通レシピに従ってイオンガンを調整した結果に関して
- ・現状の調整法と巧みの調整法によるイオンビームの形状の変化
 - ・スパッタレート、深さ分解能の差
 - ・何を目安に調整をすれば良いのか?
- 共通レシピの改善

今回の結論

- ・レシピがJEOL用になっており、PHIの装置ではイオンのイメージが見にくいので
ファラデーカップであわせた後、スポットでのスパッタ痕を見ながら調整するのが良い。
- ・巧みの調整により、形状は丸に近くなり整ってきている
- ・深さ分解能が向上している



スパッタ痕の形状と深さ分解能を目安に調整するのが良さそう

- ・共通レシピの完成度を上げよう
- 追加 : 界面の測定点数が5~7点必要